Proceedings of the 24th Linear Accelerator Meeting in Japan (July 7-9, 1999, Sapporo, Japan)

[P8-32]

Test Experiment for Bunch Form Measurement using Coherent Radiation

Katsumi WATANABE, Masayuki OYAMADA, Shigekazu URASAWA, Fujio HINODE, Bibo FENG Laboratory of Nuclear Science, Tohoku University 1-2-1 Mikamine, Taihaku-ku, Sendai 982-0826, Japan

Mikihiko IKEZAWA, Toshiaki OHSAKA, Yukio SHIBATA, Kimihiro ISHI, Tsutomu TSUTAYA, Satoshi SASAKI, Yoichi SUGIYAMA Research Institute for Scientific Measurements, Tohoku University 2-1-1, Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577, Japan

> Yasuhiro KONDO, Toshihide YOSHIMATU Department of Applied Physics, Tohoku University Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai 980-8579, Japan

Abstract

In our laboratory, the experiment of coherent radiation was resumed after the blank period for three years for construction of the STB(Stretcher-Booster Ring). Then, the Martin-Puplett type interferometer was constructed, and test experiment for bunch form measurement was done. Spectra of coherent transition and diffraction radiation were measured, but they were unexpected. In this paper, the measurement result is reported and discussed.

コヒーレント放射によるバンチ形状測定のためのテスト実験

1. はじめに

1989年、東北大核理研でコヒーレント放射光 が世界で始めて観測 いされて以来、コヒーレント 放射に関するさまざまな研究^{2,3)}が行われてきた が、1995年からストレッチャー・ブースタ リン グ(STB)の建設が始まってから、本研究施設 でのコヒーレント放射実験はとだえていた。1998 年にSTBが完成し、再びコヒーレント放射の実 験が再開された。STB建設にともないビーム偏 向室が整備され、ここでライナックからのパルス ビームを使用した実験が可能になった。

本研究ではマーチン・パプレット型干渉計を設 計、製作し、干渉分光による方法でコヒーレント 放射を計測しバンチ形状を求める方法の準備実 験として遷移放射、回折放射のスペクトル測定を 行った。その結果について報告する。

2. コヒーレント放射によるバンチ形状計測

バンチ形状を計測する方法としては、ビームに よって発生する光、たとえば遷移放射光、チェレ ンコフ光、シンクロトロン放射光等をストリーク カメラによって測定する方法がある。ストリーク カメラの分解能は 0.2ps 程度であり、将来計画さ れているリニアコライダーのバンチ長 0.27ps を 計測するには誤差が大きすぎる。これに対し、コ ヒーレント放射の測定によるバンチ形状計測で は、分解能がスペクトル測定可能範囲の短波長端 によるため、十分な分解能が得られる。 コヒーレント放射のスペクトル $I_{\omega}(\omega)$ は、次式 で与えられる。+

 $I_{tot}(\omega) = I(\omega) \{ N + N(N-1)f(\omega) \}$ (1) ここで、N はバンチ内粒子数、 $I(\omega)$ は素過程の 放射スペクトル、 $f(\omega)$ はバンチ形状因子である。 コヒーレントな場合においては、実際のバンチ内 粒子数は非常に大きいので、(1)式で N について の1次の項は無視できて

$$I_{tot}(\omega) \simeq N^2 f(\omega) I(\omega) \tag{2}$$

と書ける。スペクトルとビーム電流の測定から $I_{tar}(\omega)$ と N が分かり $I(\omega)$ は理論計算から求め られるので(2)式から形状因子が計算でき、これを 逆フーリエ変換すればバンチ形状が得られる。

3. 測定

今回、マーティン・パプレット型(振動面分割 型)の干渉分光計を製作し、これを用いて測定を 行った。測定系ブロック図を図1に示す。マーテ ィン・パプレット型はビームスプリッターとして ワイヤーグリッドを用いるものである。そのため、 ワイヤーの間隔(ここでは25µm.)より長波長 側全領域での測定が可能で、波長領域でビームス プリッターを換える必要のあるマイケルソン型 より有利である。検出器はヘリウム冷却のSiボ ロメータを用いている。可動ミラー制御およびデ ータ収集はGP-IBを介して、パーソナルコンピ ューターによって行う。

遷移放射、回折放射用のターゲットは、厚さ 3mmの回転円盤上の円孔(φ40×6)に取り付け てあり、リモートで交換できるようになっている。 図2にターゲットの形状を示す。使用したターゲ ットは遷移放射用 Al 箔が1枚、回折放射用の円 孔φ5、φ10、φ15及び幅10mmのスリットが開い た Al 箔である。いずれも厚さは15μmである。 残り1つの円孔にはスポットサイズを見るため の蛍光板(BeO)を取り付けてある。観測する放 射はビームに対して90°方向の後方放射である。



図 1. 測定系ブロック図



図 2. ターゲット

測定ビーム条件は、加速周波数 2.856GHz、ビ ームエネルギー150MeV、パルス幅 2µs、繰り返 し 16.7Hz、ビーム電流値 約 80nA (ビーム偏向 室での SEM(Secondary Emission Monitor)によ る測定値)、ビーム径 5mm (ターゲット位置) である。

4. 測定結果と考察

得られたスペクトルを図3に示す。

理論によれば、回折放射のスペクトルは遷移放 射のスペクトルに比べ、非常に小さいはずなのだ が、実験で得られた回折放射のスペクトルは遷移 放射のそれと同等の強度を持っている。ビームの 裾が回折孔の外側部分に掛かり遷移放射を出し

ている可能性も検討してみたが、回折放射におい ては、粒子の大部分は回折孔を素通りするので、 遷移放射の強度と同程度の強度をもつというこ とは考えられない。また、すべてのスペクトルに おいて水蒸気の吸収とは異なるディップが見ら れる。はじめ、光取り出し窓(溶融水晶)での干 渉と思われたが、高圧水銀灯のスペクトルを窓の ある場合とない場合とで計測してみたところ、一 様な減衰が見られるのみで取り出し窓が原因で ないことがわかった。スペクトルの波打ちの山の 間隔が 2.2cm・1 であることから干渉を起こしてい ると思われる平行平板の厚さを計算すると 1.1mm となった。この厚さで光学系内にあるも のは、光の入射する一番最初のミラーがあったが、 干渉計には正しく取り付けられており。これも原 因から除外された。他の原因として考えられるの はターゲットの形状(図2参照)、ビームの横方 向への広がり等があるが、これらについては追試 を行い、検討する予定である。

5. まとめと今後の課題

コヒーレント放射によるバンチ形状計測のた めの予備実験として、コヒーレントな遷移放射、 回折放射のスペクトル測定を行ったが、原因不明 の波打ちのあるスペクトルが得られた。今後は、 追試を行って原因を調べ、ターゲットの改良等に より遷移放射、回折放射を用いたバンチ形状モニ タとしての最適化を行っていきたいと考えてい る。また、他の共同実験として東北大学科学計測 研究所のラピッドスキャン干渉計によるバンチ 計測の研究を行っており、干渉図形の測定からバ ンチ形状の表示までを数秒から十数秒の時間で 行うことが可能である。科研のグループ、東北大 学大学院工学研究科応用物理学専攻のグループ それぞれのポリクロメータでの測定実験も行っ ている。



図 3. スペクトル

参考文献

 T. Nakazato, M. Oyamada, N. Niimura, S.Urasawa, O. Konno, A. Kagaya, R. Kato, T. Kamiyama, Y. Torizuka, T. Nanba, Y. Kondo, Y. Shibata, K. Ishi, T.Ohsaka and M. Ikezawa, Phys. Rev. Lett. 63 (1989) 1245.

Y. Shibata, K. Ishi, T. Takahashi, T. Kanai,
F.Arai, S. Kimura, T. Ohsaka, M. Ikezawa, Y.
Kondo, R.Kato, S. Urasawa, T. Nakazato, S.
Niwano, M. Yoshioka and M. Oyamada, Phys.
Rev. E 49 (1994) 785.

Y. Shibata, S. Hasebe, K. Ishi, T. Takahashi,
M. Ikezawa, T. Nakazato, M. Oyamada, T.
Yamakawa and Y. Kondo, Phys. Rev. E 52 (1995) 6787.

4) R. Rai and A. J. Sievers, Phys. Rev. E 50 (1994) R3342.